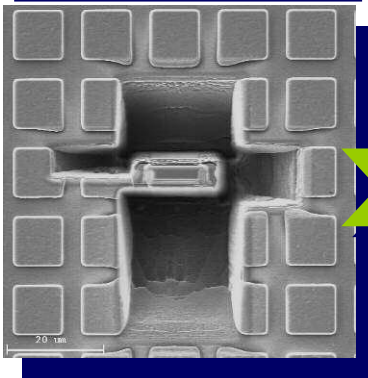


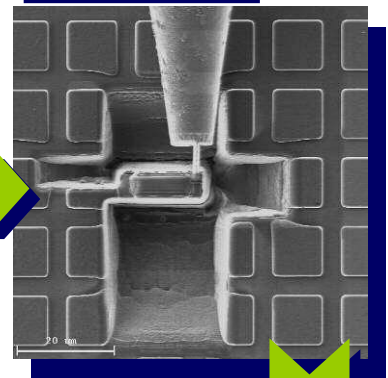
# FIBマイクロサンプリング/TEM観察方法



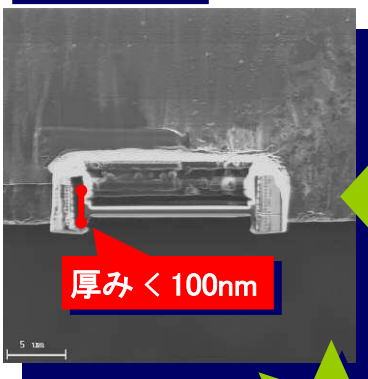
対象位置をFIB加工



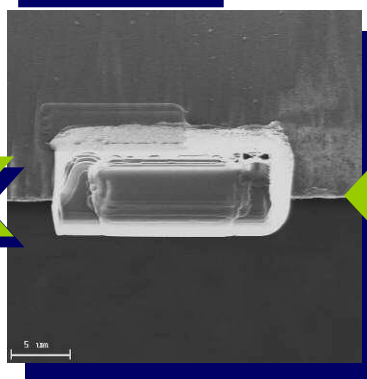
ニードル接着



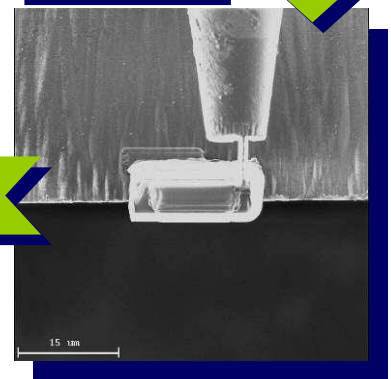
FIB加工後



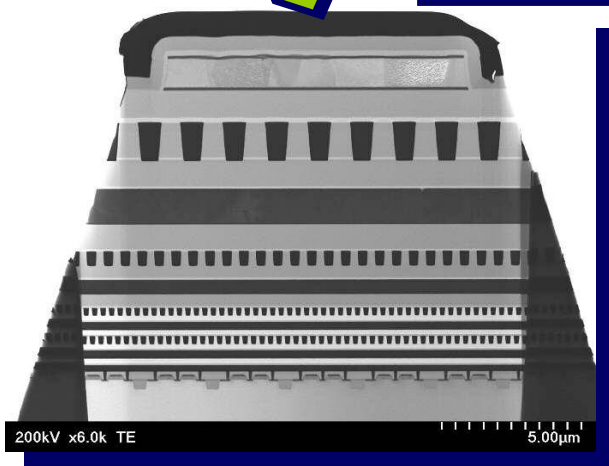
FIB薄片化



試料取出し



TEM観察



- 前処理に熟練を要する
- 試料作成に時間を要する